

CT Seminar

**BAKER
HUGHES**
a GE company



非破壊検査機器営業本部
RT/CTセールスエンジニア
菱田 寛之 博士(工学)



JMC

専務取締役COO
鈴木 浩之



第2回

産業用CTスキャンの活用セミナーレポート

昨年に引き続き、2017年もGE センシング&インスペクションテクノロジーズ株式会社と共同で「産業用CTスキャンの活用セミナー」を開催しました。

2回目の開催となる今回は、2017年9月27日(水)に東京のGE ジャパン株式会社、2017年10月6日(金)に名古屋のTKP ガーデンシティ名古屋新幹線口と開催地を拡大して行いました。

また講演内容につきましても、CTスキャンのユーザーやソフトウェアメーカーなど3社の方にご協力頂き、ダイカストにおけるCT技術の活用に関する取り組みや、CTデータを活用した解析技術について解説して頂き、多角的な視点からCTスキャンについて考察するイベントとなりました。

2会場で 80 名以上の方にご来場頂きました



各会場 4つの講演を実施しました



今回のセミナーでは各会場共通で3つの講演を行い、CTデータの解析に関する講演のみ、東京と名古屋で異なる講演を行いました。全てのセミナープログラムで3時間以上に及ぶ長い時間でありましたが、ご参加頂いた皆様には熱心に耳を傾けて頂きました。



セミナープログラム

- 講演1** 株式会社 JMC
専務取締役 鈴木浩之
「開発の現場を変えるCT スキャン、国内の最新事例と活用のヒント」
- 講演2** 美濃工業株式会社
技術センター 主席研究員 佐々木英人
「ダイカスト技術とCTの活用」
- 講演3 (東京)** ボリュームグラフィックス株式会社
執行役員シニアマネージャー 佐藤充男
「ものづくりを飛躍させるCT データ解析の更なる進展」
- 講演3 (名古屋)** 株式会社マックスネット
技術部長 石村貴暢
「フィラメント形状の解析 / 多孔質形状の解析 / 治験用 STENTのシミュレータ例」
- 講演4** GE センシング&インスペクション・テクノロジーズ株式会社
非破壊検査機器営業本部 RT/CT セールスエンジニア 菱田寛之 博士 (工学)
「世界を牽引するGEのCT ソリューション~金属 AM、in-situ 観察、他~」

株式会社 JMCの講演では、2つ目以降の講演に繋げるイントロダクションとして、初めにX線 CT 技術の基礎を説明しました。その後、受託サービスを行うなかで、各分野でどのような需要があるのかを紹介し、課題を解決するためのテクニックを提案するなど、サービスビューローならではの講演を行いました。



講演後は隣接会場で懇親会を開催しました



今回は、各会場ともセミナー会場に隣接した場所に懇親会場を用意しました。多くの方に懇親会にもご参加頂き、講演者や、同様の課題をに取り組む方々と情報交換を行うなど、有意義な時間となりました。



また名古屋会場の懇親会では、セミナー中にご記入頂いた質問に講演者が回答するコーナーや、CT 生物図鑑に関するミニセミナーを行うなど、追加でイベントを催しました。質問コーナーでは多数の質問をお寄せ頂き、専門分野の異なる講演者の方々に、より踏み込んだ内容について回答頂きました。



ご来場頂いた皆様、並びにご協力頂いた講演者の皆様、セミナーの実現にご尽力頂いたGE センシング&インスペクションテクノロジーズ株式会社の皆様にあらためてお礼申し上げます。



株式会社 JMCでは、今後もこのようなイベントを開催する予定ですので、今後とも末永くお付き合いいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。